

H22年1月22日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第145委員会
委員長 田島 道夫

(独)日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
第121回研究会 開催通知

日時：2010年2月23日(火) 13:30～17:25

会場：明治大学 駿河台キャンパス 大学会館(会議室未定)

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

東京都千代田区神田駿河台1-1 (TEL 03-3296-4545)

JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩3分

東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩5分

都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩5分

テーマ「光・電子デバイスの性能・信頼性向上を支える結晶工学」

— 次世代デバイスの高性能化・高信頼化を見据えて —

世話人：上田 修(金沢工業大学)、奥村次徳(首都大学東京)、和田一実(東京大学)、
酒井 朗(大阪大学)

プログラム

総合司会：和田 一実(東京大学)

13:30～13:35 開会の挨拶

田島 道夫(宇宙航空研究開発機構)

13:35～13:40 はじめに

上田 修(金沢工業大学)

13:40～14:20 「OBIC法による通信用半導体レーザーの劣化解析と信頼性」

竹下 達也(NTTフォトニクス研究所)

14:20～15:00 「無輻射再結合により促進される転位すべり運動に関する研究の現状」

前田 康二(東京大学)

15:00～15:20 休憩

15:20～16:00 「(仮)GaN系HEMTの信頼性」

吉川 俊英(株式会社富士通研究所基盤技術研究所)

16:00～16:40 「GaN系電子デバイスの信頼性に与える欠陥の影響」

塩島 謙次(福井大学)

16:40～17:20 「InP系HBTの信頼性」

深井 佳乃(NTTフォトニクス研究所)

17:20～17:25 おわりに

奥村 次徳(首都大学東京)

17:25～17:50 委員総会

18:00～19:50 懇親会(場所:未定)

以上